Процеси фазоутворення в аморфних та нанокристалічних системах

- 1. Система рівнянь для опису процесу гомогенного зародкоутворення в однокомпонентних та бінарних системах. Радіус та робота утворення критичного зародка, частота зародкоутворення, лінійна швидкість росту кристалів, об'ємна частка кристалічної фази.
 - Аморфні металеві сплави (АМС) це новий вид матеріалів, який карактеризується відсутністю дальнього порядку у розміщені атомів, що властивий кристалічним металам і сплавам
 - Вперше синтез АМС (металевих стекол) був здійснений в 1960 році, коли швидким гартуванням розплаву було отримано аморфний сплав Au-Si.
 - Отримання аморфних сплавів це граничний випадок екстремального нерівноважного твердіння розплаву, що приводить до утворення однофазної системи, в якій, незалежно від концентрації компонентів, відсутня трансляційна симетрія в розташуванні атомів і яка має високу ступінь структурної однорідності.

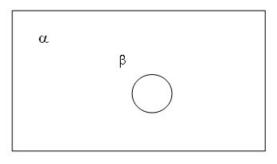
Розрізняють гомогенну та гетерогенну кристалізацію

КРИСТАЛІЗАЦІЯ	
ГОМОГЕННА	ГЕТЕРОГЕННА
Механізми утворення центрів кристалізації	
Центри кристалізації (кристалічні	Центрами кристалічних зародків
зародки) утворюються	є: окремі ділянки стінок тиглю,
флуктуаційним шляхом, в "чистій системі"	домішкові частинки оксидів та інші забруднення
Спостерігається:	
у випадку твидкісного	під час повільного охолодження
охолодження ($dT/dt \approx 10^4 \div 10^6$ K/c)	розплаву
При значному переохолодженні	При не значному переохолодженні
$\triangle T = T_p - T$	$\Delta T = T_p - T$

1. Гомогенна кристалізація однокомпонентної системи.

Розглянемо двофазну систему:

переохолоджена рідина (α -фаза) +зародок кристалічної фази (β -фаза).



Припустимо, що зародок кристалічної фази має сферичну форму з радіусом r та питомою поверхневою енергією σ .

 G^{α} – термодинамічний потенціал Гіббса для рідкої фази;

 G^{β} – термодинамічний потенціал Гіббса для кристалічної фази

причому, $G^{\beta} < G^{\alpha}$, тобто, $\triangle G^{\alpha-\beta} = G^{\alpha} - G^{\beta} > 0$.

Робота створення кристалічного зародка має дві складові:

1) роботу по створенню поверхні розділу двох фаз, тобто поверхневу складову роботи

$$A_{\rm i} = 4\pi r^2 \sigma; \tag{1}$$

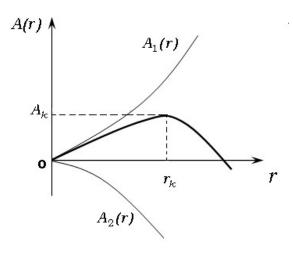
2) роботу, що пов'язана з переходом об'єму V майбутнього зародка кристалічної фази з α - в β - фазу

$$A_2 = \frac{4}{3}\pi r^3 \frac{\Delta G^{\alpha-\beta}}{V} \,. \tag{2}$$

Загальний вираз для роботи створення кристалічного зародка радіуса r у вигляді:

$$A(r) = A_1 - A_2 = 4\pi r^2 \sigma - \frac{4}{3}\pi r^3 \frac{\Delta G^{\alpha - \beta}}{V} . \tag{3}$$

На рисунку наведена залежність роботи по створенню зародка кристалічної фази від його радіусу



З умови dA/dr = 0 легко знайти критичний радіус r_k кристалічного зародка та роботу A_k по створенню кристалічного зародка критичного радіусу :

$$r_{kc} = \frac{2\sigma V}{\Delta G^{\alpha-\beta}} ,$$

$$A_{kc} = \frac{16}{3} \pi \frac{\sigma^{3} V^{2}}{(\Delta G^{\alpha-\beta})^{2}} . \tag{4}$$

Знайдемо $\Delta G^{\alpha-\beta}$ для переохолодженої однокомпонентної рідини.

За температури плавлення T_p маємо: $G^{\alpha} = G^{\beta}$.

Врахуємо явний вигляд виразів для G^{α} та G^{β} :

$$G^\alpha = H^\alpha - T_{\scriptscriptstyle D} S^\alpha \,, \quad \ G^\beta = H^\beta - T_{\scriptscriptstyle D} S^\beta \,,$$

отримаємо $\triangle G^{\alpha-\beta} = H^{\alpha} - T_{\mathcal{D}}S^{\alpha} - H^{\beta} - T_{\mathcal{D}}S^{\beta} = \triangle H_{\mathbb{O}} - T_{\mathcal{D}}\triangle S_{\mathbb{O}}$,

де $\Delta H_0 = H^{\alpha} - H^{\beta} -$ теплота плавлення металу,

 $\Delta S_0 = S^{\alpha} - S^{\beta}$ — ентропія плавлення металу.

Оскільки при $T=T_p$ $\triangle G^{\alpha-\beta}=0$, то

$$\Delta H_{\rm O} = T_p \Delta S_{\rm O} . \tag{5}$$

За довільної температури $T < T_p$ маємо $G^{\alpha} \neq G^{\beta}$ і отримаємо

$$\Delta G^{\alpha-\beta} = G^{\alpha} - G^{\beta} = \Delta H - T \Delta S.$$
 (6)

За малих переохолоджень, $\Delta T = T_p - T$, будемо вважати, що

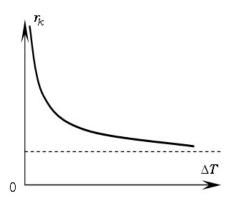
$$\Delta H \approx \Delta H_0 \quad i \quad \Delta S \approx \Delta S_0$$
,

Тобто,

$$\Delta G^{\alpha-\beta} = \Delta H - T\Delta S = \Delta H_0 - T\Delta S_0 = \Delta H_0 - T\frac{\Delta H_0}{T_p} = \Delta H_0 \left(1 - \frac{T}{T_p}\right)$$

$$\Delta G^{\alpha-\beta} = \frac{T_p - T}{T_p} \cdot \Delta H_0 \tag{7}$$

Підставимо (7) у вираз $r_k = \frac{2\sigma V}{\Delta G^{\alpha-\beta}}$, отримаємо: $r_k = \frac{2\sigma V T_p}{\Delta T \Delta H_0}$.



3 рисунку виплива€, що

1) при збільшенні переохолодження ΔT величина r_k різко зменшується, при цьому зростає ймовірність виникнення зародка кристалічної фази флуктуаційним шляхом;

(область гомогенної кристалізації)

2) поблизу точки плавлення (ΔT =0) величина r_k різко зростає, тому в цій області процес гетерогенного зародкоутворення є найбільш ймовірним.

(область гетерогенної кристалізації).

2. Кінетика гомогенного зародкоутворення.

Введемо поняття частоти зародкоутворення J

Частота зародкоутворення J – це кількість зародків, що виникають в одиниці об'єму за одиницю часу.

$$J = \frac{C}{\tau V} \exp\left(-\frac{A_k}{kT}\right),\tag{8}$$

де $\frac{C}{\tau V}$ = k_V – кінетичний коефіцієнт гомогенного зародкоутворення.

Вираз для $k_{\scriptscriptstyle V}$ має вигляд

$$k_{v} = NZi_{v}v$$
.

де N – число частинок в одиниці об'єму розплаву;

$$Z = \left(\frac{A_k}{\sqrt[3\pi n_x^2]}\right)^{\frac{1}{2}}$$
 — нерівноважний фактор Зельдовича;

 n_{x} – число частинок в зародку;

 $i_{\rm x}$ – число атомів на поверхні критичного зародка;

 $v = v_0 e^{\frac{-E}{kT}}$ — частота переходу атомів із рідини в кристалічний зародок;

 v_0 – частота коливань атомів, E – енергія активації дифузії.

Скористаємося формулою Ейнштейна для коефіцієнта самодифузії атомів:

$$D = a^2 v = D_0 \exp\left(\frac{-E}{RT}\right) ,$$

де a — середній діаметр частинок, D_0 = $a^2 v_0$, а також врахуємо, що за оцінками $Z \cong 10^{-2}$, $i_x \cong 10^2$, тобто Zi_x = 1.

Із врахуванням зазначеного

$$k_V = \frac{ND}{a^2}$$
.

Розрахунки величини $k_{\rm V}$ дають для металів такі його значення $k_{\rm V}$ = $10^{38}...10^{39}\,{\rm m}^{-3}\cdot{\rm c}^{-1}$.

Остаточний вигляд формули для обчислення частоти зародкоутворення при гомогенній кристалізації

$$J = \frac{ND}{a^2} \exp(-\frac{A_k}{kT}). \tag{9}$$

$$A_{k} = \frac{16}{3} \pi \frac{\sigma^{3} V^{2}}{(\Delta G^{\alpha-\beta})^{2}}$$

З аналізу формули (13) випливає, що для металів

при
$$T o T_p$$
 і при $T < 0.5 T_p$ маємо $e^{rac{-A_k}{kT}} o 0$,

а функція $e^{\frac{-A_k}{kT}}$ приймає максимальне значення при $T=0.7T_p$.

Таким чином, максимальна інтенсивність процесу гомогенного зародкоутворення відбувається при переохолодженні рідини до температури порядку $T=0.7T_D$.

ЛІНІЙНА ШВИДКІСТЬ РОСТУ КРИСТАЛІВ

У загальному випадку формула для лінійної швидкості росту кристалів має вигляд

$$U = \frac{D}{a} \left(1 - \exp\left(-\frac{\Delta G^{\alpha - \beta}}{RT} \right) \right). \tag{10}$$

Для однокомпонентних систем $\Delta G^{\alpha - \beta} = \Delta \mu^{\alpha - \beta}$

1) При $\Delta G^{\alpha-\beta} << RT$, тобто при невеликих переохолодженнях рідини експоненту в рівнянні (10) можна розкласти в ряд.

У результаті отримаємо

$$U = \frac{D}{RT} \cdot \frac{\triangle G^{\alpha - \beta}}{a} \quad , \tag{11}$$

Враховуючи (7), вираз (11) можна переписати у вигляді

$$U = \frac{D}{RT} \cdot \frac{\Delta H_0}{a} \cdot \frac{T_p - T}{T_p} , \qquad (12)$$

звідки випливає, що при $T \approx T_p$ матимемо $U \to 0$.

2) За значних переохолоджень $\Delta G^{\alpha-\beta} >> RT$ в рівнянні (10) можна знехтувати другим доданком.

Тоді вираз для U матиме вигляд

$$U = \frac{D_0}{a} \exp(-\frac{E}{RT}) . \tag{13}$$

Таким чином, за значних переохолоджень величина лінійної швидкості росту кристалів визначається лише коефіцієнтом дифузії.

Коефіцієнт дифузії за температур $T < 0.5T_p$ малий, і в цій області $U \to 0$.

Для металів максимум функції U(T) відповідає температурі $T \approx 0.8 T_p$.

Об'ємна частка кристалічної фази

При вивченні кінетики кристалізації важливою характеристикою є об'ємна частка кристалічної фази:

$$X(t) = \frac{V_{cr}(t)}{V_{\odot}}, \tag{14}$$

де V_{cr} – об'єм кристалічної фази; V_0 – об'єм зразка в початковий момент кристалізації

Зміну об'єму кристалічної фази за час dt можна надати у вигляді

$$dV_{cr}(t) = JV(t)\frac{4}{3}\pi(Ut)^{3} dt, \qquad (15)$$

де $V(t) = V_0 - V_{cr}(t)$.

$$dX(t) = \frac{dV_{cr}(t)}{V_0} = \frac{JV(t)\frac{4}{3}\pi(Ut)^3dt}{V_0} = \frac{J(V_0 - V_{cr}(t))\frac{4}{3}\pi(Ut)^3dt}{V_0} =$$

$$= J(1 - X(t)) \frac{4}{3} \pi (Ut)^3 dt$$
$$dX(t) = \frac{dV_{cr}(t)}{V_0} = J(1 - X(t)) \frac{4}{3} \pi (Ut)^3 dt$$

Інтегруємо останнє рівняння за умови, що U та J не залежать від часу, отримуємо

$$\frac{dX(t)}{1 - X(t)} = \frac{4}{3}J\pi(Ut)^{3}dt$$

$$ln|1 - X(t)| = -\frac{4}{3}\pi JU^{3}\frac{t^{4}}{4}$$

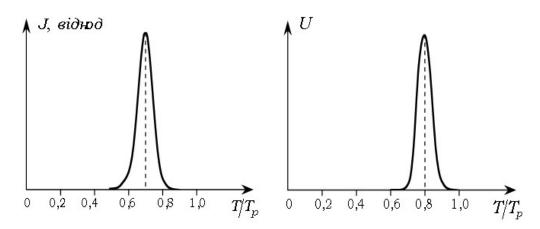
$$X(t) = 1 - exp\left(-\frac{JU^{3}\pi}{3}t^{4}\right)$$
(16)

У разі малого часу переохолодження, тобто, за умови так званого швидкісного гартування, другий доданок в (16) можна розкласти в ряд і вираз для X(t) набуває вигляду:

$$X(t) = \frac{\pi}{3} J U^3 t^4 \tag{17}$$

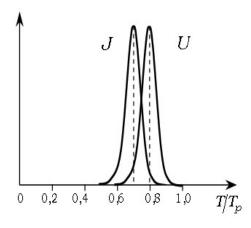
Отже, об'ємна частка кристалічної фази визначається добутком двох функції: частоти зародкоутворення і лінійної швидкості росту кристалічних зародків.

Максимуми цих функцій на температурній шкалі зсунуті один відносно одного: максимум J(t) припадає на $T\approx 0.7T_p$, а максимум U(t) – на $T\approx 0.8T_p$.



Добуток цих двох функцій дає найбільший внесок у величину об'ємної частки кристалічної фази в області температур, де ці дві функції перетинаються.

найінтенсивніше процес гомогенної кристалізації відбувається в інтервалі температур $0.7T_p < T < 0.8T_p$.



3. Гомогенна кристалізація бінарних систем.

Загальний вираз для роботи утворення зародка при гомогенній кристалізації в бінарному сплаві має вигляд:

$$A = A_1 + A_2 + A_3,$$

$$A_3 = A_{\mathrm{конц}}$$

Третій доданок у виразі для роботи пов'язаний з флуктуаціями концентрації в області утворення сферичного зародку.

Роботу утворення зародка, пов'язану з ф
луктуацієй концентрації $A_{\mathrm{конц}}$, запишемо у вигляді:

$$A_{\rm kohil} = \Delta G = \frac{4}{3} \, \pi \frac{r^3}{V_0} \, 2 \Big| \Delta G^{\alpha - \alpha} \, \Big| \, , \label{eq:kohil}$$

де r – радіус зародка кристалічної фази.

Загальний вираз для роботи утворення зародка при гомогенній кристалізації в бінарному сплаві:

$$A(r) = 4\pi r^{2} \sigma - \frac{4}{3} \pi \frac{r^{3}}{V_{0}} \Delta G^{\alpha-\beta} + \frac{4}{3} \pi \frac{r^{3}}{V_{0}} 2 |\Delta G^{\alpha-\alpha}|.$$
 (17)

Функція A(r) має максимум.

З умови dA/dr = 0 знаходимо:

$$r_{k}(C_{2}) = \frac{2\sigma V_{0}}{\left[\Delta G^{\alpha-\beta}(C_{2}) - 2\left|\Delta G^{\alpha-\alpha}(C_{2})\right|\right]},$$
(18)

$$A_{k}(C_{2}) = \frac{16}{3} \pi \frac{\sigma^{3} V_{0}^{2}}{\left| \Delta G^{\alpha-\beta}(C_{2}) - 2 \left| \Delta G^{\alpha-\alpha}(C_{2}) \right|^{2}}$$
(19)

$$\Delta G^{\alpha-\beta}(C_2) = \Delta G^{\alpha}(C_2) - \Delta G^{\beta}(C_2),$$

$$\Delta G^{\alpha-\alpha}(C_2) = \Delta G^{\alpha}(C_2) - \Delta G^{\alpha}(C_{20}).$$

 $\Delta G^{\alpha}(c_2)$ та $\Delta G^{\beta}(c_2)$ – концентраційна залежність відносної інтегральної вільної енергії в двох фазах;

 C_{20} – початкова концентрація другого компонента в α -фазі (переохолоджена рідина, аморфна фаза);

 C_2 – довільна концентрація другого компонента в α - та β -фазах.

Частота зародкоутворення у випадку бінарних сплавів

Вводиться як функція розподілу кристалічних зародків, що виникають, за значеннями концентрації

$$J_{\beta}' = dJ_{\beta} / dC_{2} = k_{V} \exp \left[-\frac{A_{k}(C_{2})}{kT} \right],$$

де k_{V} – кінетичний коефіцієнт.

Частота зародкоутворення в усій області концентрацій 2-го компонента для β- фази

$$J_{\beta} = \int_{0}^{1} J_{\beta}'(C_{2}) dC_{2}.$$

Сумарну частоту зародкоутворення кристалів різного сорту J запишемо у вигляді

$$J = \sum_{i=1}^{\infty} J_i$$
,

де k – число стабільних та метастабільних кристалічних фаз, що виникають під час кристалізації в бінарній системі.

Для опису процесу гомогенної кристалізації в бінарних сплавах використовуємо вирази:

для кінетичного коефіцієнту:

$$k_V = \frac{ND}{a^2}$$

де N — число атомів в одиниці об'єму; a — атомний діаметр; D — коефіцієнт дифузії;

• для лінійної швидкості росту кристалів i-ої фази U:

$$U_i = \frac{D}{a} \Biggl(1 - \exp\Biggl(- \frac{\Delta G^{\alpha - i} - \left| \Delta G^{\alpha - \alpha} \right|}{RT} \Biggr) \Biggr).$$